

Mesurer, analyser et innover : le défi permanent !

**Le Congrès International de Métrologie du 21 au 24 septembre 2015 (CIM 2015)
à Paris-Porte de Versailles avec le Salon ENOVA**

Le CIM est le lieu d'échanges techniques entre tous les acteurs du monde de la mesure : utilisateurs industriels de moyens de mesure, experts techniques, laboratoires publics et privés, fabricants et prestataires.

Ce Congrès est unique en Europe.

Il présente **les évolutions des techniques de mesure**, les avancées R&D et leurs implications pour l'industrie.

Il montre également **comment la mesure améliore, au quotidien, les processus industriels et la maîtrise des risques**.

Les thématiques fortes du CIM sont présentes dans les **6 tables rondes industrielles** de l'événement :

- Les bonnes pratiques en santé
- Transition énergétique : la métrologie relève le défi
- L'analyse sensorielle au service de la métrologie
- Externaliser la fonction métrologie : rêve ou réalité ?
- Agro-alimentaire : le plus métrologique
- Mesure et maîtrise des risques : nouvelle approche ISO 9001

Près de 180 conférences seront présentées sur des sujets très variés.

Les grands domaines techniques sont abordés : mécanique, température, dimensionnel et 3D, débit, électricité, optique ...

Les rappels plus généraux comme les incertitudes de mesure, l'apport des statistiques, le SI ... ne sont pas oubliés.

Les nouvelles préoccupations sont également présentes : la sécurité dans le secteur médical et l'agro-alimentaire, les défis liés à la transition énergétique, les nanotechnologies ...

Pour compléter ce panel des **visites techniques** à l'Observatoire de Paris, chez SOPEMEA et au LNE sont organisées.

Le Congrès est organisé par le Collège Français de Métrologie en partenariat avec Euramet, European co-operation for Accreditation, le BIPM, l'OIML, le NCSLI, le NPL, le DFM et le METAS pour la participation internationale. Des utilisateurs, des professionnels et des universitaires complètent l'organisation : A+Métrologie, Acac, Afnor Normalisation, BEA Métrologie, CETIAT, Hexagon Metrology, Implex, LNE, PSA Peugeot Citroën, Trescal, l'Université de Bourgogne et Wika.

Le partenaire Principal du CIM 2015 est **A+ Métrologie**.

Les autres sponsors du congrès sont : le **CETIAT, Hexagon Metrology, Implex, Metrologic Group** et **Wika**.

La DGE, direction du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, et le Ministère de la Culture accompagnent également l'organisation.

Le CIM 2015 est organisé conjointement avec ENOVA, le salon des technologies Electronique, Mesure, Vision et Optique. Les 2 organisateurs ont créé **le point de rencontre entre le congrès et le Salon au cœur de l'exposition : le Village Métrologie**.

Les temps forts du CIM 2015

- L'animation quotidienne sur le **Village Métrologie** : sur cet espace ouvert à tous se retrouvent les visiteurs du salon, les exposants qui souhaitent se rapprocher du Congrès et les participants inscrits au CIM.

Les exposants enregistrés sur le Village Métrologie au 7 avril sont les suivants : A+ Métrologie, Acalime, Aérométrie, Alicona, AOIP, Aremea, Automated Precision Europe, Beamex, Bruker, Carl Zeiss, Cetiat, Cofrac, Czech Metrology Institute, Delta Mu, E+E Elektronik, E2M, Ecole Supérieure de Métrologie, Endress & Hauser, Eotech, Felix Informatique, Furness Controls, GE Measurement & Control, Geomina, Guildline Instruments, Hexagon Metrology, Implex, Innovalia Metrology, Insavalor, Insidix, JRI, Kréon Technologies, LNE, Manumasure, MB Electronique, MCE Microvu, Measurements International, Meatest, Metrologic Group, Mettler Toledo, Nikon Metrology, Olympus, Rotronic, Sematec, Sika France, Symetrie, Testo Industrial Services, TME, Trescal, Werth Messtechnik, Wika Instruments.

- La session d'ouverture du 21 septembre avec 2 interventions sur des sujets émergents en métrologie :
 - La métrologie dans les services par le groupe La Poste
 - Métrologie et criminalistique par la Police Judiciaire de la Gendarmerie Nationale
- La conférence plénière du 23 septembre « **Métrologie 4.0** » avec des interventions des plus grands organismes mondiaux de métrologie - le NIST américain, le NPL anglais et la PTB allemande – sur la métrologie de demain qui pointe déjà son nez dans notre quotidien ...
- L'intervention de **Monsieur Claude Cohen Tannoudji, Prix Nobel de Physique 1997**, lors de la session de Clôture du jeudi 24 septembre après-midi

Participer au CIM c'est ...

... rencontrer les « bonnes » personnes qui vont **conduire plus rapidement aux « bonnes » solutions**,
... nouer une vraie **relation professionnelle avec des homologues**,
... comprendre l'**apport décisionnel de la métrologie dans les processus industriels**,
... **découvrir les technologies et les solutions** de notre quotidien de demain.

Le programme complet et l'inscription en ligne sont accessibles sur le site www.metrologie2015.com

Information presse :

Secrétariat Général du Collège Français de Métrologie

04.67.06.20.36 - info@cfmetrologie.com - www.metrologie2015.com

